

سومین کنفرانس الکترومغناطیس

مهندسی (کام) ایران

۱۳۹۳-۱۲ آذرماه



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

مشخصه یابی مغناطیسی و تعیین محور ناهمسانگردی نوار کبالت پایه به روش تشدید فرومغناطیسی با استفاده از مدوله سازی میدان

سید مرتضی محسنی ارمکی^{۱*}، سید مجید محسنی ارمکی^۲، محمد مهدی طهرانچی^{۱و۲}

۱- پژوهشکده لیزر و پلاسماء، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

۲- گروه فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

mortezamohseni@gmail.com, m-mohseni@sbu.ac.ir, teranchi@sbu.ac.ir

چکیده - یکی از دقیق ترین روش ها برای مطالعه خواص دینامیکی مواد مغناطیسی مطالعه اثر تشدید فرومغناطیسی است. در این مقاله مطالعه اثر تشدید فرومغناطیسی در نوار های کبالت پایه به روش مدوله سازی میدان صورت گرفته است. ابتدا مبانی نظری اثر تشدید و روش اندازه گیری و سپس چیدمان آزمایشگاهی تشریح گردیده و در نهایت پارامتر میرایی گلبرت، مغناطش اشباع و محور و میدان ناهمسانگردی نمونه محاسبه گردید. نتایج حاصل نشان دهنده دقت بالای روش اندازه گیری و تطبیق قابل قبول نتایج نظری و تجربی است.

کلید واژه- تشدید فرومغناطیسی، متغیر میرایی گلبرت، لانداؤ لیفشتیز، مغناطش اشباع مواد مغناطیسی

کرده و سپس با معرفی چیدمان آزمایشگاهی این روش، میدان و فرکانس تشدید را به دست آورده و در نهایت انطباق نتایج نظری

- مقدمه

و تجربی را مورد بررسی قرار میدهیم.

۲- مبانی نظری

۱-۱- مبانی نظری تشدید

تشدید فرومغناطیسی زمانی رخ میدهد که میدانی متناوب با فرکانس لارmor به ماده اعمال شود. پاسخ ماده به میدان در فرکانس های بالا (مرتبه چند صد مگاهرتز و بیشتر) خطی نیست و با در نظر گرفتن متغیر میرایی گلبرت به وسیله معادله لانداؤ-لیفشتیز-گلبرت

$$\frac{\partial M}{\partial t} = -\gamma M \times H + \frac{\alpha}{|M|} M \times \frac{\partial M}{\partial t} \quad (1)$$

توصیف میشود [۲]. در این معادله α نماد متغیر میرایی گلبرت، γ نماد ثابت زیرومغناطیسی که برای یک الکترون آزاد برابر $2\pi^* 28\text{GHz}/T$ است، M مغناطش و H میدان اعمال شده بر ماده است. جمله اول سمت راست معادله نشان دهنده حرکت

مطالعه پدیده تشدید فرومغناطیسی یکی از روش های استاندارد و دقیق برای مشخصه یابی مغناطیسی لایه های نازک است [۱]. روش های اندازه گیری پذیرفتاری مغناطیسی و مشخصه یابی مغناطیسی لایه های نازک و مواد مغناطیسی به روش تشدید فرومغناطیسی به صورت کلی شامل سه روش مرسوم اندازه گیری حوزه فرکانسی، اندازه گیری حوزه میدانی و اندازه گیری حوزه زمانی می باشد. در اندازه گیری حوزه فرکانسی، با استفاده از دستگاه تحلیل گر شبکه متغیرهای پراکندگی نمونه تحت تاثیر میدان مغناطیسی خارجی، و در اندازه گیری حوزه زمانی با استفاده از نوسانگرهای سریع پاسخ نمونه به میدان خارجی در فرکانس های بالا به دست می آورند. استفاده از روش مدوله سازی میدان به علت استفاده از تقویت کننده قفل شونده در مشخصه یابی موادی که نرخ سیگنال به نو福ه در آن ها زیاد است، از جایگاه ویژهای بخوردار است [۲و۱].

در این مقاله ابتدا با بحث روی مبانی نظری این پدیده با تمرکز بر مبانی نظری روش اندازه گیری مدوله سازی میدان شروع